文件名称 System Name:	<u>产品品名 De</u>		文件编	号 Document No	.:
				PS-0109	
Product specification	USB TYF	PE C 3.119A0	Page	1 0F 9 Rev.	X1
******	** 目 錄 C	ontent *****	****		
項 目 Item	内 容 Desc	ription		頁 次 Page	
1.	文件目录 Conten			1	
2.	变更履历 Revise	d history		2	
3. 4.	概述 Scope 参考文件 Referer	and Documon	łe	3 3	
5.	规格要求 Require		15	3 4~9	
0.				4-0	
核准 App	审核 Chk.	制作 Pre	.	Issued By:	
By ANDREW	/	刘传芳		-	
Date 2019-08-30		2019-08-3			

文件名称 System Name:	产品品名 Description:	文件编号 Document No.:				
Product specification		PS-0109				
	USB TYPE C 3.119A0	Page	2 0F 9	Rev.	X1	

Edition	ECN NO.	Revised Page	Remark
X1	ECN18060**	None	Initial Release

文件名称 System Name:	产品品名 Description:	文件纲	文件编号 Document No.:			
Product specification		PS-0109				
	USB TYPE C 3.119A0	Page	3 0F 9	Rev.	X1	

1. 概述 Scope:

1.1 说明 Content

此份产品规格书是针对由昆山嘉华电子有限公司设计和制造的 **USB TYPE C 3.119A***产品 所定义的产品性能和测试方法。

This product specification defines the product performance and the test methods to ensure the performance of the **USB TYPE C 3.119A***, which is designed and manufactured by Kunshan Jiahua Electronics Co., Ltd.

1.2 限制 Qualification

所有的测试和检验必须依照本文件中所要求的规格、方法进行。一旦产品的重要制程发生 变更,必须立即进行品质验证和测试。

Tests and inspection shall be performed in accordance with the requirements, tests and methods contained herein. A re-qualification test shall be conducted immediately following all major process changes.

2. 参考文件 Referenced Documents: EIA-364

若某些项目被发现本规格书中的内容与以上参考文件要求不一致时,一律依本规格书中的内容为 测试依据。

In case of any contradiction between this document and referenced documents, this document will take precedence.

文件名称 System Name:	产品品名 Description:	文件编号 Document No.:			
Product specification		PS-0109			
	USB TYPE C 3.119A0	Page	4 0F 9	Rev.	X1

3. 规格要求 Requirements:

3.1 应用条件 Application Condition:

3.1.1 额定电流Current Rating: VBUS AND GND CONTACTS RATED AT 2.5A, PARALLELED FOR A TOTAL OF 7.5A.(平行时总共电流7.5A) 其它PIN POWER:0.25A.

3.1.2. 额定电压 Voltage Rating: 30V AC Max.

3.1.3 使用环境 Operating Environment:

温度: -40°C to +85°C,相对湿度:15%~85%,此条件下功能不可失效。

Temperature:-40°C to +85°C, Relative Humidity:15%~85%, Without loss of function.

3.1.4 储存环境 Storage Environment:

温度: -40°C to +100°C,相对湿度:95%或更低,此条件下功能不可失效。

Temperature:-40°C to +100°C, Relative Humidity: 95% or Less, Without loss of function.

3.2 绿色环保要求 Health, Safety and Environment

此产品中所有涉及环保有关的有害物质管控标准请参考嘉华系统文件:JH-GP-213

Hazardous substances (Environment related to be controlled substances) contained in this product should comply with the regulations specified by FAF's <u>JH-GP-213</u>.

3.3 测试说明 Test Description

此产品性能须满足本文件 **3.4** 节中的各项规格要求。除非有特别申明,所有的测试和量测必须在以下条件中进行:

The product is designed to meet the requirements specified in section 3.4. Unless otherwise specified, all tests and measurements are to be performed under the following conditions:

温度 Temperature: 15℃~35℃

相对湿度 Relative Humidity: 20% to 70%

大气压 Atmospheric Pressure: 650 to 800 millimeters (25.6 to 31.5 inches) of Mercury.

****** Copyright is reserved by FAF ******

Г

Product specification USB TYPE C 3.119A0 Page 50F9 Rev X1	文件名称 System Name:	产品品名 Description:	文件编号 Document No.:				
Product specification USB TYPE C 3.119A0 Page 50F9 Rev X1	Product specification		PS-0109				
		USB TYPE C 3.119A0	Page	5 0F 9	Rev.	X1	

1

	方法 Test Requirements and Method	
Table I: 性能要求 Per 项目 Items	formance Requirements 规格要求 Requirements	测试方法 Test Methods
项日 items 3.4.1 产品外观	目视和其他合适的仪器检测产品的外观 结构及尺寸满足图面要求	参考测试标准: EIA-364-18 依照相应的文件和规格书进行外观,功能,及尺寸的
Visual Examination	Check that appearance $\$ construction and dimension of connector are in accordance with drawing by eyes and suitable instruments.	检验量测. Comply with method EIA-364-18 Appearance, functional, and dimensional inspection complies with applicable specification and document
3.4.2 SMT 产品耐 Reflow 高温 Withstand Temperature For SMT type.	外观: 良好 Appearance: Good	300℃ 200℃ 100℃ Heating Rate : 3℃/sec 150~190℃,60~120sec 217℃,90~120sec
3.4.3 低功率接触阻抗	初始接触阻抗: 40mΩ Max. 测试后接触阻抗: 40mmΩ Max;.	IR 1 次 For IR one time. 参考测试标准: EIA-364-23 必须保证量测结果为产品以及与之对应配对产品 的焊接部位之间的阻抗值;
Low Level Contact Resistance	Initial: 40mΩ Max; After Test: 40mmΩ Max;	Comply with method EIA-364-23. with the exception of the resistance readings, which shall be measured between the termination points of tested plug and connector
3.4.4 绝缘阻抗 Insulation Resistance	100 MΩ Min.	参考测试标准: EIA-364-21. 使用 500V 直流电压 1Min±5 秒,在相邻两端子 或接地片之间
		Comply with method: EIA-364-21 Apply a voltage 500VDC 1Min± 5 Sec. between adjacent terminals or between terminal and ground.

文件名称 System Name:	产品品名 Description:	文件编号 Document No.:				
Product specification		PS-0109				
	USB TYPE C 3.119A0	Page	6 0F 9	Rev.	X1	

3.4.5 耐电压 Dielectric Withstanding Voltage	加电压期间漏电流不超过 0.5mA. 同时不 能产生电弧、短路烧焦及击穿 No evidence of breakdown 、 flash burn caused by short circuit and insulation destruction. Current leakage: 0.50 mA Max.	参考测试标准: EIA-364-20; 使用交流 100V 的电压(测试后使用 250V 的电压) 在相邻两端子或接地片之间保持 1 分钟+/-5 秒 Comply with method: EIA-364-20 Apply a voltage 100VAC(apply 250V AC After test) for 1 Min± 5Sec between adjacent terminals or between terminals to ground.
3.4.6 温度上升 Temperature rise	将样品与插头连接,电源和信号 端子分别通过测试额定电流, 记录3 小时后的温度上升情况. Mated and measure the temperature rise of contact when the rated current is passed after 3 hours.	温度上升 30℃Max. Temperature rise:30℃Max.

Kunshan Jiahua Electronics Co., Ltd. 文件名称 System Name・ ----

文件名称 System Name:	产品品名 Description:	文件编号 Document No.:			
Product specification		PS-0109			
	USB TYPE C 3.119A0	Page	7 0F 9	Rev.	X1

项目 Items	规格要求 Requirements	测试方法 Test Methods
3.4.7	1.测试后接触阻抗: 40mΩ Max;.	参考测试标准: EIA-364-28,
振动	2. 瞬断 : 1 u sec Max.	测试电流: 100mA. 每个方向振动 2H,
		振幅:1.5mm, 频率每分钟 10-55-10HZ
Vibration		Comply with EIA-364-28
	1. After Test: $40 \text{m} \Omega$ Max;	Current of 100mA shall be applied during the
	2. Discontinue: 1u sec Max.	testing. The vibration shall be along each axis
		for the period of two hours with the max amplitude of 1.5mm and frequency of 10-55-
		10HZ/Min
3.4.8	不产生超过 lu 秒的瞬断, 产品没有物理	参考测试标准: EIA-364-27 Condition A
机械冲击		加速度: 50G;波形:半正弦冲击波;时间:
	格要求.	11 毫秒;正反三个相互垂直方向各冲击3
Physical Shock		文,共18次.
	No electrical discontinuity longer than 1u	Comply with EIA-364-27 Condition B
	sec. No mechanical damage or looseness,	Duration Pulse : 11 msec.,
	contact resistance specifications remain	Wave form : half sine, 50G, Both direction of
	satisfied.	mutually perpendicular axes. Total 18 shocks
3.4.9	外观无任何损坏	参考测试标准: EIA-364-09;
耐久插拔	Appearance: no damage	以最大每小时 500 次的速度连
	耐久后接触电阻值:最大40mΩ.	续插拨公母座10000次
Durability	After test contact	Mate/un-mate up to 10000 cycles
	resistance: 40mΩ Max.	repeatedly at Max. speed of 500
	插入力: 5~20N	cycles/hr.
	Mating Force: 5~20N	-
	拨出力: 8~20N (1000 次)	
	Un-mating Force: 8~20N	
	(1000cycles)	
	拨出力: 6~20N(10000 次)	
	Un-mating Force: 6~20N	
	(10000cycles)	
	(10000cycles)	
3.4.10	插入力 5N~20N	参考测试标准: EIA-364-13.
插入力/拔出力	拔出力 8N~20N	测试过程中产品运动速度:每分种 12.5mm
Mating force&	Insertion Force 5N~20N	Comply with method EIA -364-13.
Un-mating force	Withdrawal Force 8N~20N	Connector mated/unmated at maximum rate of
		12.5 mm per minute.

Xunshan Jiahua Electronics Co., Ltd. 文件名称 System Name

文件名称 System Name:	产品品名 Description:	文件编号 Document No.:				
Product specification		PS-0109				
	USB TYPE C 3.119A0	Page	8 0F 9	Rev.	X1	

3.4.11 1. 测试后接触阻抗: 40mΩ Max. 参考测试标准: EIA-364-26 盐雾实验 2. 外观:良好 法水量度: 33±2 (%,取 g 5±1%,时间:48 小明 Salt Spray 1. After the test LLCR: 40mΩ Max. Comply with method EIA-364-26. Salt solutio temperature 35±2 (, Concentration 5±1%, Duration: 48H. 3.4.12 产晶外观无损伤 参考测试标准: EIA-364-22C 热冲击测试 Appearance: no damage 粉样品与插头连接, 按如下条件置于 测试后接触电阻在最大40 mΩ After testing contact resistance: 40mΩ Max. 4/9% 电阻最小100MΩ -55 +0-3°C 30分钟 -25 +10°C 5分钟 Insulation resistance:100MΩ -55 +0-3°C 30分钟 25 ±10°C 5分钟 3.4.13 产品外观无损伤 参考测试标准: EIA-364-31B 高温高湿循环 Appearance: no damage 樹对湿度 95~100% High temperature 测试后接触电阻在最大40 mΩ 品度和时间: & High Appearance: no damage #17½度 95~10°C 30分钟 High temperature Appearance: no damage #17½度 95~10°C 30% High temperature Appearance: no damage #17½度 95~10°G Min. Appearance: no damage: #17½度 95~10°G Min. Appearance: no damage: #17½度 95~10°G Min. Appearance: no damage: <td< th=""><th>项目 Items</th><th>规格要求 Requirements</th><th>测试方法 Test Methods</th></td<>	项目 Items	规格要求 Requirements	测试方法 Test Methods				
Salt Spray 1. After the test LLCR: 40mΩ Max. Comply with method EIA-364-26. Salt solutio Salt Spray 1. After the test LLCR: 40mΩ Max. Comply with method EIA-364-26. Salt solutio 34.12 Appearance: Good Duration: 48H. Sakmarian PEBA\$\mathcal{M}\mathcal{T}\mathcal{H}\mathcal{D}\mathcal{H}\mathcal{L}\mathcal{H}\mathcal{L}\mathcal{H}\mathcal{L}\mathcal\mathcal{L}\math							
Salt Spray1.After the test LLCR: $40m\Omega$ Max.temperature $35\pm2^{\circ}C$, Concentration $5\pm1\%$, Duration: $48H$.3.4.12产品外观无损伤 為冲击测试分pearance: GoodDuration: $48H$.3.4.12产品外观无损伤 和pearance: no damage 测试后接触电阻在最大40 mΩ After testing contact resistance: $40m\Omega$ Max. 	盐雾实验	2. 外观:良好	盐水温度: 35±2℃,浓度 5±1%,时间: 48 小时.				
34.12 产品外观无损伤 多考测试标准: EIA-364-32C 热冲击测试 产品外观无损伤 参考测试标准: EIA-364-32C Thermal Shock 测试后接触电阻在最大40 mΩ 将样品与插头连接,按如下条件置于 测试后接触电阻在最大40 mΩ After testing contact resistance: 40mΩ Max. 40mΩ Max. 绝缘电阻最小100MΩ Fab max max 1.13 产品外观无损伤 55 +0/-3°C 30分钟 34.13 产品外观无损伤 参考测试标准: EIA-364-31B 高温高湿循环 Appearance: no damage 相对湿度 95~100% High temperature 测试后接触电阻在最大40 mΩ 温度和时间: &High After testing contact resistance: 40mΩ Max. 40mΩ Max. 55~C 3 小时-> 5°C 9 小时> 5%和时一> 25~5°C 3 小时-> 5%和时一> 25°C 9 小时> 25°C 9 小时> 25°C 9 小时> 25°C 9 小时-> 25°C 9 小时-> 25°C 9 小时-> 34.14 Appearance: no damage; Min. Appearance: no damage; Min. Min. 34.14 外观无任何损坏 Agearance: no damage; Min. After test contact resistance: MmΩ Appearance: no damage;	Solt Smarr						
3.4.12 热冲击测试 Thermal Shock产品外观无损伤 Appearance: no damage 测试后接触电阻在最大40 mQ After testing contact resistance: 40mQ Max. 绝缘电阻最小100MQ Insulation resistance:100MQ Min.参考测试标准: EIA-364-32C 将样品与插头连接,按如下条件置于 以下环境循环5次,结束后,将测试 增品置于常温下恢复1~2小时后进行 测试; -55+0/-3°C 30分钟 25±10°C 5分钟 *85 +3/-0°C 30分钟 25±10°C 5分钟 *87测试标准: EIA-364-31B 相对湿度 95~100% 温度和时间: 25~55°C 3 小时—> 55°C 9 小时—> 55°C 9 小时—> 25°C 9 小时	San Spray		•				
热冲击测试// 面/ 加/	2 4 12						
Thermal Shock词试后接触电阻在最大40 mQ After testing contact resistance: 40mQ Max. 绝缘电阻最小100MQ Insulation resistance:100MQ Min.以下环境循环5次,结束后,将测试 样品置于常温下恢复1~2小时后进行 测试: -55 +0/-3°C 30分钟 25 ±10°C 5分钟 +25 ±10°C 5分钟 25 ±10°C 5分钟 25 ±10°C 5分钟 25 ±10°C 5分钟 25 ±10°C 5分钟 25 ±10°C 5分钟 25 ±10°C 5分钟 4Dread Particle 25 ±10°C 5分钟 4Dread Particle 第週试后接触电阻在最大40 mQ After testing contact resistance: 如试后接触电阻在最大40 mQ After testing contact resistance: 25~55°C 3小时> 绝缘电阻最小100MQ 1nsulation resistance:100MQ Min.Ø下环境循环5次,结束后,将测试 半品置于常温下恢复1~2小时后进行 测试 25 ±10°C 5分钟 45 ±3/-0°C 30分钟 25 ±10°C 5分钟 3.4.14 温度寿命测试 Temperature lifeØTF环境循环5次,结束后,将测试 学家测试标准: EIA-364-31B 和对湿度 95~100% 温度和时间: 25~55°C 3小时> 25°C 9小时> 25°C 9小时> 25°C 9小时3.4.14 温度寿命测试 Temperature life3.4.14 温度寿命测试 Temperature life3.4.14 温度寿命测试 Temperature life3.4.14 温度寿命测试 Temperature life3.4.14 温度参询测试 化in.3.4.14 温度寿命测试 Temperature life3.4.15 温度寿命测试 Temperature life3.4.14 温度寿命测试 Min.3.4.15 温度寿命测试 Temperature life3.4.16 加试 加试 Min.3.4.17 温度寿命测试 Min.3.4.18 温度寿命测试 Min.3.4.19 加试 加试 Min.3.4.14 加试 Min.3.4.15 Min. <td></td> <td></td> <td></td>							
After testing contact resistance: 40mΩ Max. 绝缘电阻最小100MΩ Insulation resistance:100MΩ Min.样品置于常温下恢复1~2小时后进行 测试: $55 + 0/-3 \mathbb{C}$ 30分钟 $25 \pm 10 \mathbb{C}$ 5分钟 $85 + 3/-0 \mathbb{C}$ 30分钟 $85 + 3/-0 \mathbb{C}$ 30分钟 $25 \pm 10 \mathbb{C}$ 5分钟 $85 + 3/-0 \mathbb{C}$ 30分钟 $85 + 3/-0 \mathbb{C}$ 30分钟 $25 \pm 10 \mathbb{C}$ 5分钟 $85 + 3/-0 \mathbb{C}$ 30分钟 $85 + 3/-0 \mathbb{C}$ 300% $86 + 31 \mathbb{B}$ $86 + 31 \mathbb{B}$							
Atom Contact resistance:測试: > $40mC Max.$ $40mC Max.$ $40mC Max.$ $40mC Max.$ $40mC Max.$ $55 + 0/-3^{\circ}C 30$ 分钟 $25 \pm 10^{\circ}C 5$ 分钟Insulation resistance: 100MQ $25 \pm 10^{\circ}C 5$ 分钟 34.13 $\overrightarrow{P} = B A \mathcal{P} \mathcal{R} \mathcal{T}_{d} \mathcal{P}_{d}$ $\overline{Bala} = \overline{a} \mathbb{Z}^{d} \overline{m}$ $\overrightarrow{P} = B A \mathcal{P} \mathcal{R} \mathcal{T}_{d} \mathcal{P}_{d}$ $\overline{Bala} = \overline{a} \mathbb{Z}^{d} \overline{m}$ $\overrightarrow{P} = B A \mathcal{P} \mathcal{R} \mathcal{T}_{d} \mathcal{P}_{d}$ $\overline{Bala} = \overline{a} \mathbb{Z}^{d} \overline{m}$ $\overrightarrow{P} = B A \mathcal{P} \mathcal{R} \mathcal{T}_{d} \mathcal{P}_{d}$ $\overline{Bala} = \overline{a} \mathbb{Z}^{d} \overline{m}$ $\overrightarrow{P} = B A \mathcal{P} \mathcal{R} \mathcal{T}_{d} \mathcal{P}_{d}$ $\overline{Bala} = \overline{a} \mathbb{Z}^{d} \overline{m}$ $\overrightarrow{P} = B A \mathcal{P} \mathcal{R} \mathcal{T}_{d} \mathcal{P}_{d}$ $\overline{Bala} = \overline{a} \mathbb{Z}^{d} \overline{m}$ $\overrightarrow{P} = B A \mathcal{P} \mathcal{R} \mathcal{T}_{d} \mathcal{P}_{d}$ $\overline{Bala} = \overline{a} \mathbb{Z}^{d} \overline{m}$ $\overrightarrow{P} = B A \mathcal{P} \mathcal{R} \mathcal{T}_{d} \mathcal{P}_{d}$ $\overline{Bala} = \overline{a} \mathbb{Z}^{d} \overline{m} \mathcal{P}_{d}$ $\overrightarrow{P} = B A \mathcal{P} \mathcal{R} \mathcal{T}_{d} \mathcal{P}_{d}$ $\overline{Bala} = \overline{a} \mathbb{Z}^{d} \overline{m} \mathcal{P}_{d}$ $\overline{Appearance: no damage}$ $\overline{Humidity Cycle}$ $A \mathcal{P} \mathcal{R} \mathcal{T} \mathcal{L} (m \mathcal{Q} \mathcal{M} \mathcal{P})$ $A fler test contact resistance: 100 M \Omega$ $55^{\circ} 25^{\circ} C 3 \wedge m m - >$ $1 \text{Insulation resistance: no damage:}$ $\overline{P} = 105 \pm 2^{\circ} C \Gamma 120 \Lambda$ $\overline{Mic} E \mathcal{B} \oplus 10 \mathcal{O} M \Omega \mathcal{N} \mathcal{L}$ $\overline{B} \pi 1 - 2 \Lambda m f E \mathcal{H} \mathcal{H} \oplus \mathbb{Z} \mathcal{H} \mathcal{H} \oplus \mathbb{Z} \mathcal{H} \oplus \mathbb{Z}$ 34.14 $\mathcal{A} ppearance: no damage: m damage: m damage: m damage: m damage: m damage: 40m\Omega Max.$ $\overline{Mic} E \mathcal{B} \oplus 100 M \Omega \Omega \mathcal{L}$ $\overline{B} \pi 1 - 2 \Lambda m f E \mathcal{H} \mathcal{H} \oplus \mathbb{Z} \mathcal{H} \oplus Z$	Thermal Shock						
40m2 Max. 第後象电阻最小100MΩ -55 +0/-3 °C 30分钟 約mailer 1msulation resistance: 100MΩ -55 +0/-3 °C 30分钟 1msulation resistance: 100MΩ $55 \pm 10 °C 5 Å \Phi^{+}$ 3.4.13 产品外观无损伤 参考测试标准: EIA-364-31B 高温高湿循环 Appearance: no damage 相对湿度 95~100% High temperature 测试后接触电阻在最大40 mΩ 温度和时间: & High After testing contact resistance: 25~55 °C 3 小时> Humidity Cycle After testing contact resistance: 25~25 °C 3 小时> 1msulation resistance:100MΩ 55~25 °C 3 小时> 1msulation resistance:100MΩ 55°C 9 小时 Min. 40mΩ Aax. 55°C 9 小时 3.4.14 外观无任何损坏 57°C 9 小时 温度寿命测试 Appearance: no damage: 57°C 9 小时 Min. 54%% 57°C 120 小 Min. 46% 电阻:最小100MΩ以上 1msufer Eif Min.							
記録電阻最小100M225 ±10 \mathbb{C} 5分钟 +85 +3/-0 \mathbb{C} 30分钟 25 ±10 \mathbb{C} 5分钟3.4.13 高温高湿循环产品外观无损伤 Appearance: no damage 测试后接触电阻在最大40 mQ After testing contact resistance: 40mQ Max. 绝缘电阻最小100MQ Min.参考测试标准: EIA-364-31B 相对湿度 95~100% 温度和时间: 25~55 \mathbb{C} 3 小时> 55 \mathbb{C} 9 小时> 55 \mathbb{C} 9 小时> 25 \mathbb{C} 9 小时> 25 \mathbb{C} 9 小时> 25 \mathbb{C} 9 小时 25 \mathbb{C} 9 \mathbb{C} 25 \mathbb{C} 9 \mathbb{C} 25 \mathbb{C} 9 \mathbb{C} 10 \mathbb{C} 25 \mathbb{C} 9 \mathbb{C} 10 \mathbb{C} 25 \mathbb{C} 9 \mathbb{C} 25 $\mathbb{C} 9$ \mathbb{C} 25 \mathbb{C} 9 \mathbb{C} 25 \mathbb{C} 9 \mathbb{C} 25 \mathbb{C} 9 \mathbb{C} 25 \mathbb{C} 9 \mathbb{C}							
Insulation resistance: $100M\Omega$ Min.+85 +3/-0°C 30分钟 25 ±10°C 5分钟3.4.13 高温高湿循环 High temperature &High Humidity Cycle产品外观无损伤 Appearance: no damage 测试后接触电阻在最大40 mQ After testing contact resistance: $40m\Omega$ Max. $40m\Omega$ Max. $40m\Omega$ Max. $40m\Omega$ Max. $40m\Omega$ Max. $55°C 9 \wedge bf>$ $55~25°C 3 \wedge bf>55~25°C 3 \wedge bf>55~25°C 3 \wedge bf>55~25°C 3 \wedge bf>25°C 9 \wedge$							
Min.25±10℃ 5分钟3.4.13 高温高湿循环 High temperature &High Humidity Cycle产品外观无损伤 Appearance: no damage 测试后接触电阻在最大40 mΩ After testing contact resistance: $40m\Omega$ Max.参考测试标准: EIA-364-31B 相对湿度 95~100% 温度和时间: $25~55℃ 3 小时>$ $55℃ 9 小时>$ $55℃ 9 小时>55~25℃ 3 小时>55~25℃ 3 小时>55~25℃ 3 小时>25℃ 9 小时>25℃ 9 小时>3.4.14温度寿命测试Temperature life外观无任何损坏Appearance: no damage;测试后接触电阻:最大40mΩ下.After test contact resistance:40m\Omega Max.4%电阻:最大40mΩ下.After test contact resistance:40m\Omega Max.4%电阻:最大100MΩMin.参考测试标准: EIA-364-17将样品置于105±2℃下120 小时,结束后,将测试样品置于常温下 1~2 小时后进行测试;$							
3.4.13 产品外观无损伤 参考测试标准: EIA-364-31B 高温高湿循环 Appearance: no damage 相对湿度 95~100% 湘讨湿度 95~100% 温度和时间: &High After testing contact resistance: 25~55℃ 3 小时> Humidity Cycle 40mΩ Max. 55℃ 9 小时> ½% 电阻最小100MΩ 55~25℃ 3 小时> Insulation resistance: 100MΩ 55~25℃ 3 小时> Min. 55℃ 9 小时> 25℃ 9 小时> 25℃ 9 小时 3.4.14 外观无任何损坏 温度寿命测试 不ppearance: no damage; アemperature life 外观无任何损坏 After test contact resistance: 40mΩ Max. 绝缘电阻:最大40mΩ下. 将样品置于105±2℃下120 小 After test contact resistance: 40mΩ Max. 绝缘电阻:最小100MΩ以上 Insulation resistance: Min. 40mΩ Max. 绝缘电阻:最小100MΩ以上 Insulation resistance: 100MΩ Min. Min.		Min.					
高温高湿循环 High temperature & High Humidity CycleAppearance: no damage 测试后接触电阻在最大40 mΩ After testing contact resistance: $40m\Omega$ Max. 绝缘电阻最小100MΩ Insulation resistance:100MΩ Min.相对湿度 95~100% 温度和时间: $25~55 °C 3 小时>$ $55 °C 9 小时>$ $25 °C 9 小时>25 °C 9 小时>3.4.14温度寿命测试Temperature life外观无任何损坏Appearance: no damage;测试后接触电阻:最大40mΩ下.After test contact resistance:40m\Omega Max.40m\Omega Max.40m\Omega Max.40m\Omega Max.40m\Omega Max.参考测试标准: EIA-364-17将样品置于105±2°C下120 小时,结束后,将测试样品置于常温下 1~2 小时后进行测试;3.4.14加风 Max.绝缘电阻:最小100MΩ以上Insulation resistance:100MΩMin.Min.$	3.4.13	产品外观无损伤					
High temperature & High Humidity CycleImplicit for the tank of tan	高温高湿循环						
&High Humidity Cycle After testing contact resistance: 40mΩ Max. 25~55℃ 3 小时> 55℃ 9 小时> .40mΩ Max. 绝缘电阻最小100MΩ .55℃ 9 小时> 55~25℃ 3 小时> .1sulation resistance:100MΩ .1	High temperature						
Humidity Cycle $40m\Omega$ Max. 绝缘电阻最小100MΩ Insulation resistance:100MΩ Min. $55 C 9 \wedge \text{时}>$ $55~25 C 3 \wedge \text{I}>$ $25 C 9 \wedge \text{I}>$ $25 C 9 \wedge \text{I}>$ 3.4.14 温度寿命测试 Temperature life外观无任何损坏 Appearance: no damage; 	&High						
绝缘电阻最小100MΩ Insulation resistance:100MΩ Min.55~25℃ 3 小时> 25℃ 9 小时3.4.14 温度寿命测试 Temperature life外观无任何损坏 Appearance: no damage; 测试后接触电阻:最大40mΩ下. After test contact resistance: 40mΩ Max. 绝缘电阻:最小100MΩ以上 Insulation resistance:100MΩ Min.参考测试标准: EIA-364-17 将样品置于105±2℃下120 小 时,结束后,将测试样品置于常 温下 1~2 小时后进行测试;	Humidity Cycle						
Insulation resistance:100MΩ 25℃ 9 小时 3.4.14 外观无任何损坏 温度寿命测试 Appearance: no damage; Temperature life 测试后接触电阻:最大40mΩ下. After test contact resistance: 40mΩ Max. 绝缘电阻:最小100MΩ以上 温下 1~2 小时后进行测试; Insulation resistance:100MΩ Min.		绝缘电阻最小100MΩ					
Min. 25℃ 9小时 3.4.14 外观无任何损坏 温度寿命测试 Appearance: no damage; Temperature life 测试后接触电阻:最大40mΩ下. After test contact resistance: 40mΩ Max. 绝缘电阻:最小100MΩ以上 温下 1~2 小时后进行测试; Insulation resistance:100MΩ Min.							
温度寿命测试 Temperature life Appearance: no damage; 测试后接触电阻:最大40mΩ下. After test contact resistance: 40mΩ Max. 绝缘电阻:最小100MΩ以上 Insulation resistance:100MΩ Min.		Min.					
 温度寿命测试 Temperature life Appearance: no damage; 测试后接触电阻:最大40mΩ下. After test contact resistance: 40mΩ Max. 绝缘电阻:最小100MΩ以上 Insulation resistance:100MΩ Min. 	3.4.14	外观无任何损坏	参考测试标准: EIA-364-17				
Temperature life 测试后接触电阻:最大40mΩ下. 时,结束后,将测试样品置于常 After test contact resistance: 温下 1~2 小时后进行测试; 40mΩ Max. 绝缘电阻:最小100MΩ以上 Insulation resistance:100MΩ Min.	温度寿命测试		将样品置于105±2℃下120 小				
After test contact resistance: 40mΩ Max. 绝缘电阻:最小100MΩ以上 Insulation resistance:100MΩ Min.	Temperature life		时,结束后,将测试样品置于常				
40mΩ Max. 绝缘电阻:最小100MΩ以上 Insulation resistance:100MΩ Min.							
绝缘电阻:最小100MΩ以上 Insulation resistance:100MΩ Min.							
Insulation resistance:100MΩ Min.							
Min.							
3.4.15 焊接部位吃锡面积在95%以上 参考测试标准: EIA-364-52							
	3.4.15		参考测试标准: EIA-364-52				
· 将焊锡部分尾部浸到融化的锡炉里,温度							
焊锡性 The termination is at least 95% 245+5℃, 4~5 秒							
Solderability Covered by a continuous solder coating. Comply with method EIA-364-52	Solderability	Covered by a continuous solder coating.	-				
Dip solder tails into the molten solder held			Dip solder tails into the molten solder held				
at $245\pm5^{\circ}$ C for $4\sim5$ seconds.			at 245±5°C for 4~5 seconds.				

Kunshan Jiahua Electronics Co., Ltd. 文件名称 System Name: 产品品名 Des

文件名称 System Name:	产品品名 Description:	文件编号 Document No.:					
Product specification		PS-0109					
	USB TYPE C 3.119A0	Page	9 0F 9	Rev.	X1		

项目 Items	规格	A要求 Requirements 测试方法 Test Methods										
测试项目 Test Item		群组测试 Test Group										
		А	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	J	K
产品外观 Visual Examination		1,7	1,8	1,8	1,4	1,6	1,7	1,6	1,3			
低功率接触阻抗 Contact Resistance	Low Level	3,6	3,7	3,5		3,5	3,5	3,5				
绝缘阻抗 Insulation Resistance				6			6					
耐电压 Dielectric Withstanding Volt	age			7								
温度上升 Temperature Rise					3							
插拔耐久 Durability			5									
振动 Vibration		5										
机械冲击 Shock (Mechanical)		4										
插拔力 Mating/Unmating Forces			4,6									
热冲击测试Thermal Shock				4								
盐雾腐蚀 Salt Spray								4				
高温高湿循环High temperature&High Humidity Cycle							4					
温度寿命测试Temperature life						4						
焊锡性Solderability									2			
SMT 产品耐 Reflow 高温 WithstandTemperature For SMT type.		2	2	2	2	2	2	2				
Sample Size*		5	5	5	5	5	5	5	5			